

出展製品のご案内

アナログ技術をコアとする製品とサービスで社会に貢献します

アナログ、ミックスドでトップシェアのシバソクは、パワーテスターもトップを目指します。

WL27 Prime Mixed Signal LSI Test System

NEW

■WL27 Primeは、LSIからマイコン内蔵パワーデバイスまで対応可能なテストシステムです。

主な特徴

- ◆ ①100MHzデジタルを1024pinまで実装可能
- ◆ ②最大同時測定 128個
- ◆ ③マルチパターンジェネレータ、SCAN、ALPG機能搭載
- ◆ ④PMU、TMUをパーピンで実装
- ◆ ⑤大電流、高電圧モジュール実装でパワーデバイス対応



パワー半導体動特性テストシステム

■MOS/IGBTのAC測定システムで、AC TEST HEADは弊社WL25 / WL15VW / SCV66等、LSI TEST SYSTEMと組み合わせてパワーデバイスの動特性試験を行います。

主な特徴

- ◆ ①Lsを最小限に抑えコンタクト及び測定物にダメージを与えることなく安心してご使用頂く為、高速遮断可能な保護回路を搭載
- ◆ ②PIPGによる容易なプログラム作成
- ◆ ③MultiWaveによる、波形解析機能



IGBT/IPM 静特性テストシステム

■電流の立上りを高速化することにより、大電流での発熱を抑え、高精度で再現性の高い測定が可能です。

主な特徴

- ◆ ①大電流、高電圧、小電流 Vth対応
- ◆ ②高速大電流ソースを搭載 最大1600A
- ◆ ③IGES, ICES(X), VCE_sat, Vth, etc

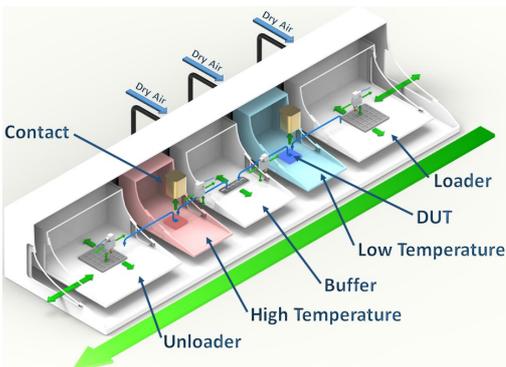


低温試験装置(開発中)

■ペルチェユニットのみで-55℃環境を実現する装置のご紹介です。

主な特徴

- ◆ ①低温試験 (ステージ追加で高温試験にも対応可)
- ◆ ②-55℃環境での結露なし





The elements of innovation

SEMICON[®] JAPAN

12月13日(水)～15日(金) 東京ビッグサイト
ブースNo.2021 (Hall 2) でお待ちしております。

株式会社シバソク

<http://www.shibasoku.co.jp/>

ごあいさつ

お客様各位

拝啓

貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

弊社は、来る12月13日(水)から東京ビッグサイトにて開催される「**セミコンジャパン2017**」にパワー半導体のウェーハテストからモジュールテストまでのシステムを中心に展覧いたします。(ブースNo.2021、Hall 2)

省エネ・低炭素社会に向けた新技術開発への世界的な取り組みが進むなか、コンシューマ・産業用機器を問わずパワー半導体の需要は増すばかりです。これら進化・拡大を続けるマーケットに向けて、パワー半導体のテストソリューションをシステムでご提案します。

ご多忙の中大変恐縮ではございますが、万障お繰り合わせの上ご来場賜りますようご案内申し上げます。

敬具

平成29年11月吉日

株式会社 シバソク

代表取締役社長兼C.E.O.

重崎 隆

SEMICON[®] JAPAN